II Международная научная конференция

«Приоритетные направления научных исследований нанообъектов искусственного и природного происхождения»

"State-of-the-art trends of scientific researches of artificial and natural nanoobjects"

(STRANN-2011)

25-26 мая 2011 года

Санкт-Петербург

Организаторы:

Санкт-Петербургский Государственный Университет, МРЦ-НТ

Zeiss NTS, ООО «ОПТЭК»

Место проведения С-Петербург, Старый Петергоф, ул. Ульяновская, д. 1, конференцзал НИИ Физики им. В.А. Фока СПбГУ.

Конференция «STRANN-2011», которая является продолжением серии конференций, первая из которых состоялась в 2009 году, представит обзор новых научных результатов в области наноматериаловедения и нанобиотехнологии.

«STRANN-2011» предоставит возможность обмена информацией и установления новых контактов между специалистами самого различного профиля - геологов, химиков, физиков, специалистов в области нанодиагностики и разработчиков аппаратуры для исследования нанообъектов.

В программе конференции предусматривает устные и стендовые доклады с результатами оригинальных исследований, а также приглашенные лекции ученых из ведущих университетов Европы, специалистов в области электронной и сканирующей зондовой микроскопии из Германии, США и России.
К началу конференции будут изданы тезисы докладов ее участников.

Рабочие языки: русский, английский.

Дополнительная информация (контакты, формат тезисов и.т.п.) преставлена на сайте http://nano.spbu.ru или может быть запрошена по e-mail- strann2011@nano,spbu.ru

.

Важные даты

Регистрация и представление тезисов

на странице конференции на сайте http://nano.spbu.ru/index.php/ru/strann-2011

До 11 апреля

- **Информация о принятии доклада**

20 апреля

Контакты оргкомитета

e-mail: STRANN-2011@nano.spbu.ru .
Москва: Екатерина Кутузова +7 (495) 933 51 51
С-Петербург: Юрий Петров +7 (812) 428-44-77

Приглашенные докладчики, подтвердившие свое участие

Хайнер Якш

Carl Zeiss NTS GmbH, Германия

Механизмы формирования контраста обратно-рассеянных электронов с малыми потерями в автоэмиссионном СЭМ в науках о материалах и в биологии

Латышев Юрий Ильич

Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия

Получение наноструктур на основе слоистых материалов с помощью FIB и исследование их свойств

Йорг Линденау

Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Германия

Открытия в конфокальной и сверхвысокоразрешающей микроскопии

Дэн Пикард

Национальный университет Сингапура, Сингапур

Формирование наноразмерных изображений и решение прикладных задач бионанотехнологий методами гелиево-ионной микроскопии

Йоахим Любке

Исследовательский центр Юлиха, Институт Нейробиологии и Медицины, Германия

Анализ структуры синапсов на субклеточном уровне при помощи передовых электронно-микроскопических методов исследований и систем компьютерного моделирования

Дубровский Владимир Германович

ФТИ им. Иоффе, Россия

Выращивание гетероструктур и вискерсов

Планируются еще 2-3 приглашенных докладчика. Следите за новостями на сайте